

# Vacuum test fixture

## VA 3070S-2e/ZSK-10P-2e/i3070

Article 115202



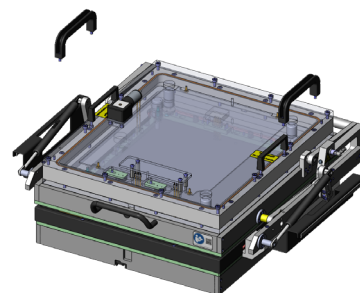
DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Interface de test sous vide avec cassette sous vide serrant en parallèle.
- Y compris interface adaptatrice pour système de test Keysight i3070
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift
- Version robuste, facile à entretenir, d'une longévité hors pair
- Confort d'utilisation accru, manipulation simple et intuitive
- Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

NEW



### Utilisation

Les interfaces de test sous vide (VA) sont utilisées pour mettre en contact, de façon sûre en processus, des cartes électroniques en grands nombres et comptant peu de variantes.

### Version

- Plaque porte-contacts en FR4 invariable épais de 14 mm
- Plaque d'applique en FR3 épais de 8 mm, avec surface conductrice ESD
- Joint de vide INGUN confirmé longue durée, à faible usure
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift pour un transport confortable
- Pièces de cadre latérales avec ébréchure programmée et couvercle en plastique, pour le montage de compte-courses disponibles en option
- Verrouillages disponibles en option pour sécuriser la plaque d'applique

### Livraison

La livraison a lieu non montée. Cela permet un traitement immédiat spécifique pour l'objet à tester. Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

#### Remarque :

Pour l'équipement professionnel de l'interface de test sous vide VA 3070, le schéma d'équipement INFO 4677 est utilisé, et la consigne d'équipement INFO 4675 pour tenir compte de zones barrées d'accès (Keepouts).

#### Remarque :

Les positions dans les zones L004/L008:S11/S30 et L232/L236:S49/S68 ne peuvent pas, en raison de l'exécution des canaux d'aspiration, être garnies de broches de transmission.

# Vacuum test fixture

## VA 3070S-2e/ZSK-10P-2e/i3070

Article 115202



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

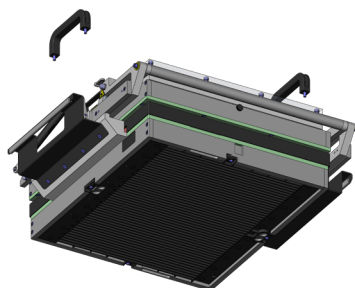
Partner for Future Technology

### Données générales

Interface pour système de test:	Keysight i3070 petit
Groupe de produits:	Interface de test sous vide (VA)
Série principale:	VA xxxx
Sous-série:	VA 30xx
Série:	VA 3070S
Taille du type:	xx70S
Type d'interface de test:	Interface individuelle, disp. de mise en contact supplémentaire, Keysight petit
Génération de course de contact:	vide
Type de boîtier:	Boîtier plat
Signaux d'interface max.:	0
Blocs d'interface requis:	non
Blocs d'interface internes max.:	0
Sens de mise en contact:	ICT/FCT en bas, en haut
Force de contact max.:	13.000 N
Course de contact parallèle env.:	12 mm
Poids:	32 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Basse tension:	non
Conformité ESD:	non
Conforme RoHS:	oui

### Caractéristiques techniques

Longueur du poussoir du dispositif de placage:	15 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:	16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en haut:	21,5 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:	21,5 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB:	10 mm
Version standard:	oui
Version ESD:	non
Version haute fréquence:	non
Version à aiguille rigide:	non
Version à 2 niveaux:	oui
Mise en contact en haut (ZSK):	oui
Surface utile ZSK (LxP):	260 x 300 mm
Dimensions hors tout fermé (LxPxH):	631 x 534 x 209 mm



### Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

Vacuum test fixture

**VA 3070S-2e/ZSK-10P-2e/i3070**

Article 115202



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Kits d'interface de test**

